


ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 097

wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie nr 11 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r.

 <p>AP 097</p>	<p>Nazwa i adres</p> <p>ROMB SPÓŁKA AKCYJNA LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE ul. Kujańska 10 e 77-400 Złotów</p>
<p>Kategoria laboratorium: działające w stałej siedzibie (S)</p>	<p>Dziedziny akredytacji¹⁾ Wielkości geometryczne (6.01, 6.04)</p>

Wersja strony: A

¹⁾ Numeracja dziedzin i poddziedzin zgodna z klasyfikacją podaną w załączniku do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

TADEUSZ MATRAS

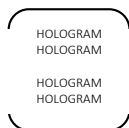
Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj obiektu wzorcowania	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru CMC	Kat. Lab.	Identyfikacja metody
6. Wielkości geometryczne				
6.01 długość				
plytki wzorcowe kl. 0, 1, 2	(0,5 ÷ 100) mm	(0,06 + 0,5 L) μm L w m	S	P-27.00.00
przyrządy suwmiarkowe:				
- suwmiarki	(0 ÷ 150) mm	20 μm	S	P-18.00.00
- wysokościomierze suwmiarkowe	(0 ÷ 300) mm	21 μm		
- głębokościomierze suwmiarkowe	(0 ÷ 600) mm	41 μm		
przyrządy mikrometryczne:				
- mikrometry zewnętrzne	(0 ÷ 25) mm (25 ÷ 50) mm (50 ÷ 75) mm (75 ÷ 100) mm (100 ÷ 200) mm (200 ÷ 300) mm (300 ÷ 400) mm (400 ÷ 500) mm (500 ÷ 600) mm	2,0 μm 2,0 μm 2,4 μm 3,0 μm 5,6 μm 8,2 μm 10,9 μm 13,6 μm 16,3 μm	S	P-24.00.00
- mikrometry wewnętrzne	(5 ÷ 30) mm (30 ÷ 55) mm	1,5 μm 1,9 μm	S	P-24.00.00
- średnicówki mikrometryczne dwupunktowe	(30 ÷ 100) mm (100 ÷ 200) mm	3,0 μm 5,6 μm	S	P-24.00.00
- mikrometry z wbudowanym czujnikiem			S	P-25.00.00
- zespół mikrometryczny	(0 ÷ 25) mm	1,4 μm		
- zespół czujnikowy				
- działka elementarna 0,002 mm		1,0 μm		
- działka elementarna 0,001 mm		0,6 μm		
- zespół mikrometryczny	(25 ÷ 50) mm	1,8 μm		
- zespół czujnikowy				
- działka elementarna 0,002 mm		1,0 μm		
- działka elementarna 0,001 mm		0,8 μm		
przyrządy czujnikowe				
- czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm	(0 ÷ 25,4) mm (0 ÷ 50,8) mm	6,0 μm 6,1 μm	S	P-20.00.00
- czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,001 mm	(0 ÷ 12,7) mm (0 ÷ 25,4) mm (0 ÷ 50,8) mm	1,1 μm 1,3 μm 1,7 μm	S	P-20.00.00
- czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,01 mm	(0 ÷ 10) mm (0 ÷ 30) mm (0 ÷ 50) mm	2,7 μm 2,9 μm 3,3 μm	S	P-20.00.00
- czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,001 mm	(0 ÷ 5) mm	1,3 μm	S	P-20.00.00
- czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,01 mm	± 1,5 mm	2,7 μm	S	P-23.00.00
- czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,001 mm	± 0,2 mm	1,3 μm	S	P-23.00.00
- waleczki pomiarowe	(1 ÷ 20) mm	0,9 μm	S	P-29.00.00
sita kontrolne	20 μm ÷ 0,5 mm (0,5 ÷ 1) mm (1 ÷ 5) mm (5 ÷ 125) mm	3,0 μm 6,5 μm 9,0 μm 0,05 mm	S	P-34.00.00
6.04 pomiary współrzędnościowe				
sprawdziany specjalne	średnica otworu: (ø 3 ÷ ø 220) mm przy zachowaniu grubości elementów stalowych minimum 1 mm maksimum 30 mm długość: (0,1 ÷ 500) mm wysokość: (0,1 ÷ 400) mm szerokość: (0,1 ÷ 400) mm odchyłki kształtu: - okrągłość odchyłki położenia: - współosiowość kąt: (0 ÷ 360) °	(4,4 + 0,04 L) μm L w mm 00 ° 06 ' 30 "	S	P-37.00.00

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 097

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

ZASTĘPCA DYREKTORA

TADEUSZ MATRAS
dnia: 10.08.2016 r.